

Minőségbiztosítás a mikroelektronikában

II. Zárthelyi dolgozat

2012.

1. Si egykristály hibáinak vizsgálata
2. négytűs mérés
3. IC hibamérés
4. mit lehet mérni C-V módszerrel
5. gépkéesség és minőségkapacitás (elméleti, statikus, dinamikus) számítás
6. C-V; 4tűs vizsgálat; számolós példa: gépkéesség